

# IR-2双波段发射率测量仪

产品名称	IR-2双波段发射率测量仪
公司名称	深圳市探索时代科技有限公司
价格	170000.00/台
规格参数	品牌:TSSD 型号:IR-2 产地:中国
公司地址	光明区马田街道马山头社区第七工业区127栋
联系电话	13322998008

## 产品详情

详细说明：

IR-2双波段发射率测量仪采用反射率法的测试原理，即通过采用主动黑体辐射源测定待测物表面的法向反射率，进而测出其在特定红外波段的法向发射率。该仪器可测量常温样品在3~5 $\mu\text{m}$ 、8~14 $\mu\text{m}$ 、1~22 $\mu\text{m}$ 三个波段发射率。对特殊需要的用户，通过专用的控温加热装置，在常温至300 温度范围加热样品，进行发射率变温测量。该仪器主要用于军事装备的红外隐身、红外烘烤、建材、纸张、纺织等行业对材料红外辐射特性的测量研究。

仪器特点：

1. 仪器中有小型标准黑体辐射源，采用六位高精度微机控温仪(能显示到1mk)，使仪器不仅具有稳定的宽光谱测量范围，而且极大地提高了仪器在测量时的可靠性和稳定性。
2. 采用了独特的光学调制技术，使测量不受被测物表面辐射及环境辐射的影响。
3. 在仪器设计中，考虑到样品漫反射引起的测量误差，除镜反射(MR)探测通道外，还增设了专门的漫反射(DR)补偿通道，从而确保了仪器的测量精度。
4. 在信号及电子学处理技术上采用锁相技术和微电子学技术，较好地实现了对微弱信号的探测，进一步提高了仪器性能。
5. 本仪器操作简单、使用方便、测量快速。
6. 可按需更换滤光片，在多个红外光谱波段内进行测试。
7. 在测量过程中不损伤被测样品。

8. 本仪器带RS-232串口及复位键RST。

### 主要技术指标

1. 测量波段：3~5um、8~14um、1~22um

(若用户有特殊要求，可定制不同波段滤光片)

2. 发射率测量范围：0.01~0.99

3. 灵敏度NE : 0.001

4. 示值误差： $\pm 0.02$  ( $>0.50$ )

5. 重复性： $\pm 0.01$

6. 样品温度：常温(特殊用户为常温~300 )

7. 样品尺寸： $> 50$

8. 测量时间：3秒后按测量键E，即显示 测量值。

9. 显示方法：LED数字显示，末位0.001

10. 电 源：交流220V 50HZ